



COMBETTE Flise

2013



2014 PIL

> NOM: Combette PRENOM: EQUE .

DE De l'Atome à la Puce

Question 1:

On donne l'expression de la densité de courant totale dans un semi-conducteur:

$$J = q\mu_n n\varepsilon + q\mu_p p\varepsilon + qD_n \frac{dn}{dx} - qD_p \frac{dp}{dx}$$

On considère un échantillon de Germanium à T=300 K avec une concentration de dopage de Nd=0 et Na=1016 cm-3. On suppose que les mobilités des électrons et des trous sont 3900 cm²/V.s et 1900 cm²/V.s respectivement. Le champ électrique appliqué est de 50 V/cm. Soit n_i=2,4x10¹³ cm⁻³. Calculer la densité de courant dans l'échantillon. Justifier raisonnement et

On sait d'après la relation d'Einstein que $\frac{D_1}{U_0} = \frac{D_2}{U_0} = \frac{kT}{Q}$.

Donc qDn = un kt et qDp = up kt. D'ai:

J=q(un+upp)E+ tet (undn-updp)

 $p = N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ et $n = N_b = 0$ donc on re considére que les trous, le semi-conducteur est dopé p:

J=quppE- to up dp = up (qpe-kor dp). dio" = 0!!

= $1900 (1,6.10^{-19} \times 10^{16} \times 50 - 0.0259 \times 10^{16})$

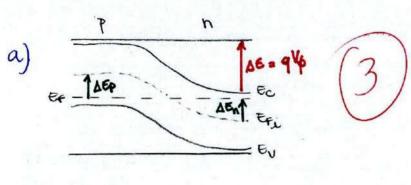
= $152 - 4,921,10^{17} = -4,921,10^{17}$ c(cm) 8^{-1}

PIL

Question 2:

- a) Tracer le modèle énergétique d'une jonction pn en équilibre thermique.
- b) Démontrer que le potentiel de jonction peut être exprimé avec l'expression suivante :

$$V_{\phi} = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right)$$



b) ΔE=qVp = ΔEn+ ΔEp = Ex-(Exi)n+(Exi)p- Ex = (Exi)p- Exi)n

On southque n=nie(Ex-Exi)(RT = Ny et p=nie(Ex-Ex)(RT = NA. On

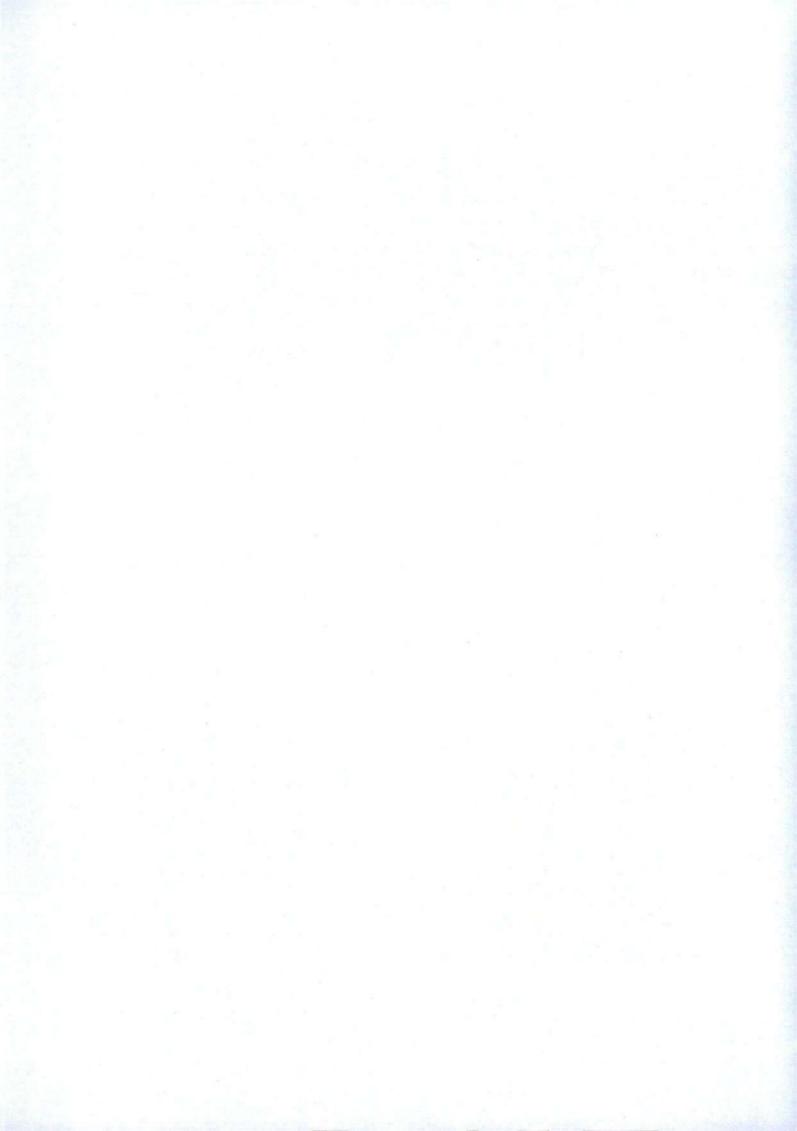
calcule donc (Efi)n et (Efi)p:

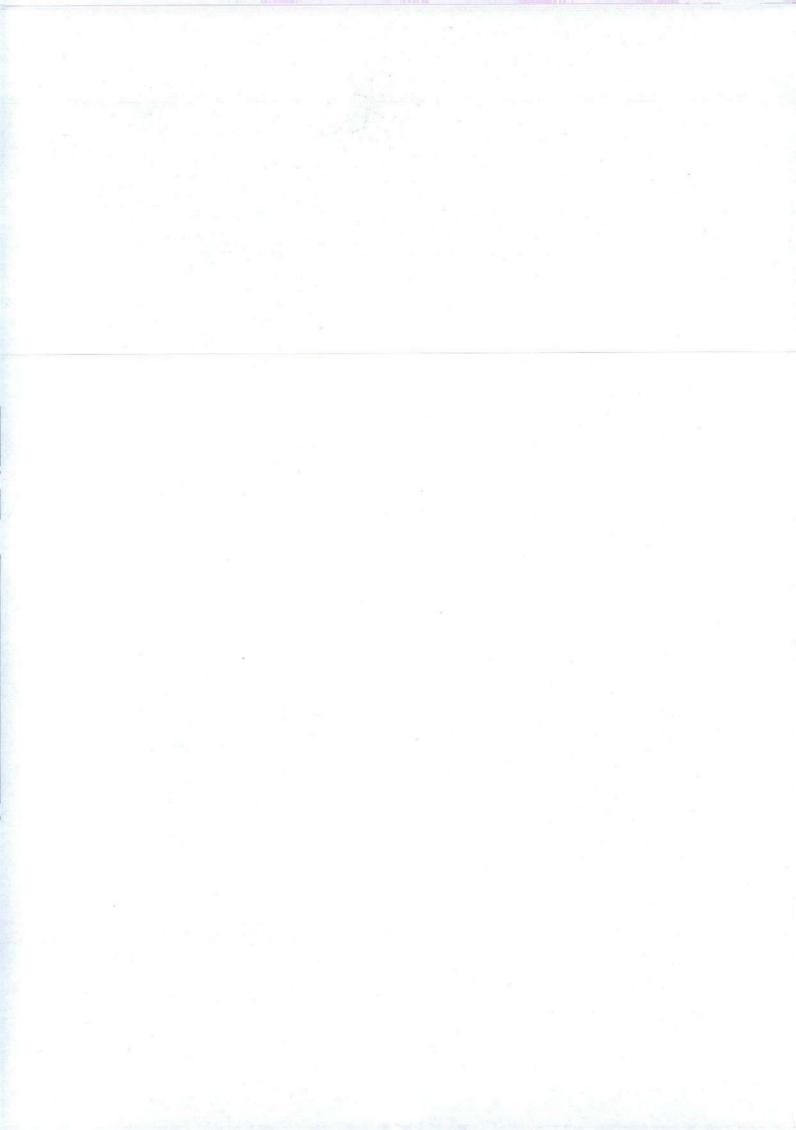
EF-EFi = On ND donc (EFi) =- let ln ND + EF

* NA= nie (EFi- EF) (EFi- EF) (FT = NA ni

EFI-EF = ln NA donc (Fi)p= kt ln NA + EF

D'ai $\Delta E = qV\phi = kT \ln \frac{NA}{ni} + E_F + kT \ln \frac{ND}{ni} - E_F$ $= qV\phi = kT \left(\ln \frac{NA}{ni} + \ln \frac{ND}{ni} \right)$ $= V\phi = \frac{kT}{q} \ln \frac{NAND}{ni^2}$





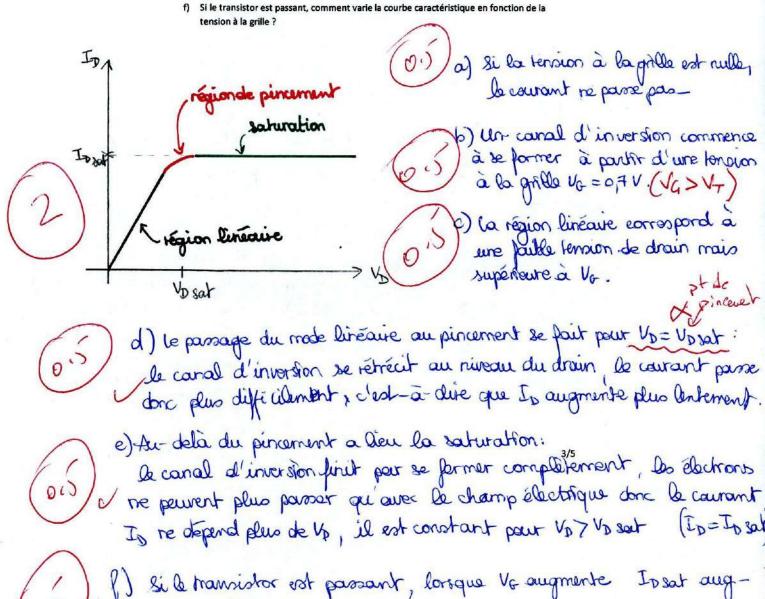
mente également.

2014

PIL

Tracer l'évolution d'une courbe caractéristique (I-V) d'un transistor MOS de type n à enrichissement, et décrire les modes d'opération correspondant à chaque région de la courbe en termes de tensions appliquées à la grille et au drain relativement à la source. Répondre aux questions suivantes qui vous serviront comme guide.

- a) Que se passe-t-il si la tension à la grille est nulle ?
- b) A partir de quelle valeur de tension à la grille commence à se former un canal d'inversion ? quelle est l'influence de la tension du drain sur la conductance dans ce cas ?
- c) Pour quelle condition principale de tension correspond la région linéaire ?
- d) Comment passe-t-on du mode linéaire au pincement ? à quelle valeur de tension de drain se produit le point de pincement ?
- e) Comment est appelé le mode d'opération au-delà du pincement ? pourquoi ?
- f) Si le transistor est passant, comment varie la courbe caractéristique en fonction de la





PIL

Question 4:

Décrire avec une ou deux phrases l'étape de fabrication appliquée pour produire chacune des transformations dans la fabrication d'un transistor nMOS à enrichissement.

Substrat p-

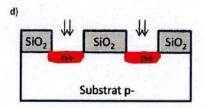
on depe légèrement le substrat en silicium avec des atomes de Bore (p).

SiO₂
Substrat p-

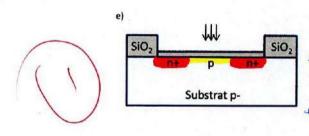
on ajoute une couche d'exyde sio2 par exydathon apaisse sur le substrat dopé p.

sio_ sio_ sio_ sio_ on ourre les zones de source et de drain par photolithagnaurure: on applique une résire positive, on l'expose à un rayonnement UV avec un masque optique laissant parser les UV au niveau des zones à élimine on développe (la résine exposée est éliminée), on grave l'exyde à l'aide d'une solution acide, puis on retire la résine restante.



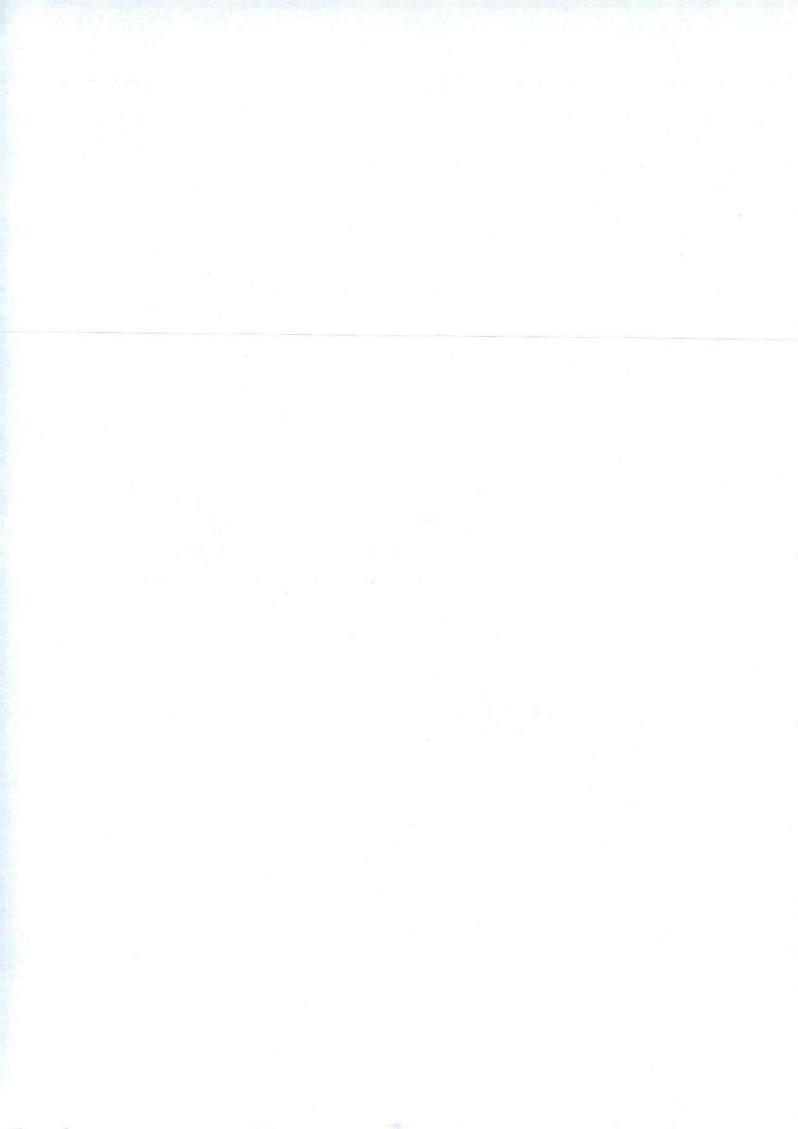


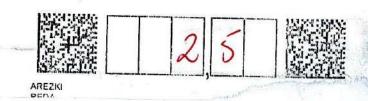
SiO2 W SiO2 On dope fortement los gones de source et de drown avac du phosphore (n).



on dope la zone de carrol d'inversion avec de atoms de Bore (p), après avoir retué l'or xyde au niveau de la grille par photolithogranus et ajouté une couche d'axyde par exydation fine.

ene couche d'alluminium et on ouvre les zones complémentaires oux zones de contact par photolithagravuse.







PIL

NOM: AREZKI

PRENOM:

Réda

DE De l'Atome à la Puce

Question 1:

On donne l'expression de la densité de courant totale dans un semi-conducteur:

$$J = q\mu_n n\varepsilon + q\mu_p p\varepsilon + qD_n \frac{dn}{dx} - qD_p \frac{dp}{dx}$$

On considère un échantillon de Germanium à T=300 K avec une concentration de dopage de Nd=0 et Na=10¹⁶ cm⁻³. On suppose que les mobilités des électrons et des trous sont 3900 cm²/V.s et 1900 cm²/V.s respectivement. Le champ électrique appliqué est de 50 V/cm. Soit n_i=2,4x10¹³ cm⁻³. Calculer la densité de courant dans l'échantillon. Justifier raisonnement et calcul.



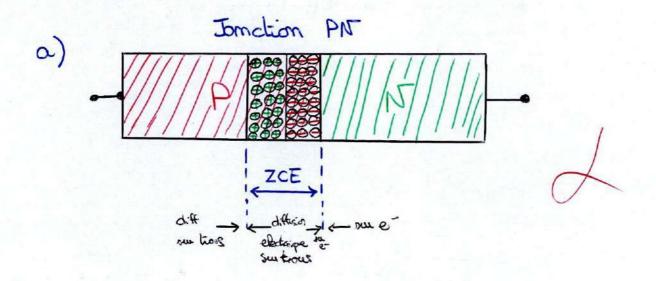


PIL

Question 2:

- a) Tracer le modèle énergétique d'une jonction pn en équilibre thermique.
- b) Démontrer que le potentiel de jonction peut être exprimé avec l'expression suivante :

$$V_{\phi} = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right)$$



b)
$$V_{\beta} = \frac{kT}{q} \operatorname{Im}\left(\frac{N_A N_D}{m_i^2}\right) \text{ correspond à la tension de diffusion}$$
oneo:
$$\Delta E = q V_{\beta} = -q N_A + q N_D$$

$$m_i^2 = mp = N_A N_B$$

$$m = \frac{m_i^2}{N_B}$$
or
$$q V_{\beta} = q N_D - q N_A = q \left(N_D - N_A\right)$$

om Sout que:

$$\begin{bmatrix}
N_D = m_i \exp\left(\frac{E_C - E_F}{kTT}\right) \\
N_A = m_i \exp\left(\frac{E_A - E_F}{kTT}\right)
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
N_A N_D = m_i^2 \exp\left(-\frac{E_O - E_F}{kTT}\right) \exp\left(\frac{E_A - E_F}{kTT}\right)
\end{bmatrix}$$

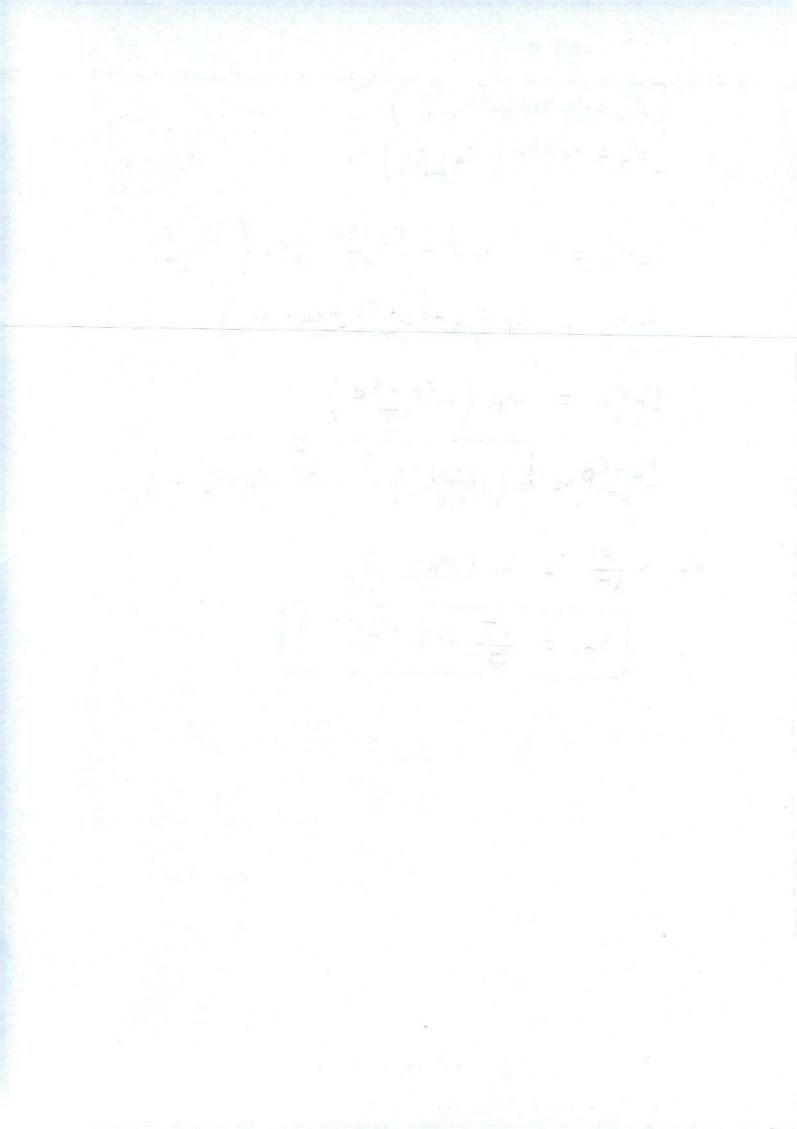
$$\frac{N_A N_D}{m_i^2} = \exp\left(\frac{E_A - E_O}{kTT}\right)$$

$$\frac{N_A N_D}{m_i^2} = \exp\left(\frac{E_A - E_O}{kTT}\right)$$

$$\frac{E_A - E_O}{kTT} = e_n\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right)$$
or
$$E_A - E_O = e_n\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right)$$

$$V_{\phi} = \frac{e_n}{kT} = e_n\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right)$$

$$V_{\phi} = \frac{e_n}{kT} = e_n\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right)$$



PIL

Question 3:

Tracer l'évolution d'une courbe caractéristique (I-V) d'un transistor MOS de type n à enrichissement, et décrire les modes d'opération correspondant à chaque région de la courbe en termes de tensions appliquées à la grille et au drain relativement à la source. Répondre aux questions suivantes qui vous serviront comme guide.

- a) Que se passe-t-il si la tension à la grille est nulle ?
- b) A partir de quelle valeur de tension à la grille commence à se former un canal d'inversion ? quelle est l'influence de la tension du drain sur la conductance dans ce cas ?
- c) Pour quelle condition principale de tension correspond la région linéaire ?
- d) Comment passe-t-on du mode linéaire au pincement ? à quelle valeur de tension de drain se produit le point de pincement ?
- e) Comment est appelé le mode d'opération au-delà du pincement ? pourquoi ?
- f) Si le transistor est passant, comment varie la courbe caractéristique en fonction de la tension à la grille ?

(015)a)

Li la temsion à la quille est nulle alors le semi-conducteur est un isolant.

A partir d'une tomsion superione à 4 v le canal de gible commence à former un canal d'inversion.

La tension du drain permet de réquelibrer cette tension

C) la région liméaire Correspond

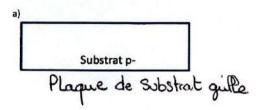
3/5



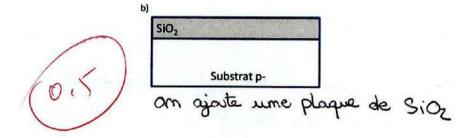
PIL

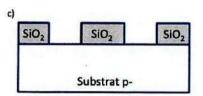
Question 4:

Décrire avec une ou deux phrases l'étape de fabrication appliquée pour produire chacune des transformations dans la fabrication d'un transistor nMOS à enrichissement.



4





Affranchissement de la plaque de SiOZ

